

<<电子元器件可靠性试验工程>>

图书基本信息

书名：<<电子元器件可靠性试验工程>>

13位ISBN编号：9787121009655

10位ISBN编号：712100965X

出版时间：2005-3-1

出版时间：电子工业出版社

作者：罗雯,阳辉,魏建中

页数：350

字数：590000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子元器件可靠性试验工程>>

内容概要

本书包括了电子元器件可靠性试验的各主要类别：环境试验（包括13类环境和综合环境试验）；寿命试验和加速寿命试验；鉴定试验；极限应力试验；可靠性筛选试验；可靠性增长试验。

各试验类别包括了原理、理论模型、试验设计、实施程序、设备要求、关键技术及试验示例等并介绍了相关的可靠性基础知识和数理统计方法，提供了元器件失效分析和破坏性物理分析方法、程序及其关键性技术，使用状态中元器件失效预测技术。

本书可作为高校教师、研究生、本科生及从事可靠性研究的工程技术人员工作的参考书。

<<电子元器件可靠性试验工程>>

书籍目录

第1章 概论 1.1 可靠性术语和参数 1.2 电子元器件的可靠性表征 1.3 可靠性试验的目的和分类 1.4 可靠性试验技术的发展 参考文献第2章 可靠性数学及应用 2.1 寿命分布 2.2 抽样检验 2.3 试验数据的处理方法 参考文献第3章 寿命试验 3.1 寿命与应力的关系 3.2 指数分布寿命试验 3.3 加速寿命试验 3.4 寿命试验中的一些技术问题 参考文献第4章 环境试验 4.1 概述 4.2 气候环境试验 4.3 机械环境试验 4.4 水浸渍试验 4.5 低气压试验 4.6 太阳辐射试验 4.7 电离辐射试验 4.8 盐雾腐蚀试验 4.9 霉菌试验 4.10 沙尘试验 4.11 地震试验 4.12 声震试验 4.13 运输试验 4.14 天然环境试验 4.15 综合环境试验 参考文献第5章 极限应力试验 5.1 极限应力试验的概念 5.2 进行极限应力试验的目的和作用 5.3 极限应力试验的电参数测试 5.4 极限应力试验的程序 5.5 极限应力试验方法 5.6 案例 参考文献第6章 电子元器件鉴定试验.....第7章 可靠性筛选试验第8章 可靠性增长试验第9章 元器件失效分析和失效机理第10章 破坏性物理分析 (DPA) 第11章 使用状态中元器件失效预测技术第12章 试验数据信息智能化管理系统 (LIMS) 参考文献

<<电子元器件可靠性试验工程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>